# Le memorie ad accesso casuale

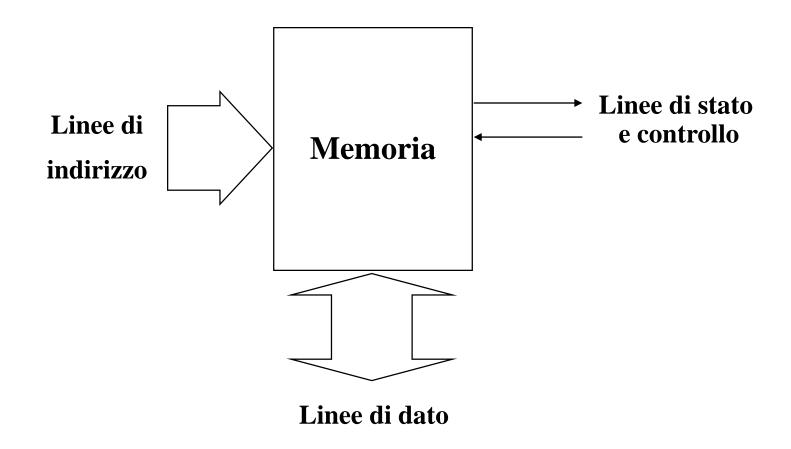
Matteo Sonza Reorda

Politecnico di Torino Dip. di Automatica e Informatica



## Caratteristiche generali

- Ogni cella può essere indirizzata indipendentemente
- · I tempi di accesso sono uguali e costanti per ogni cella.



#### **Funzionamento**

#### Lettura:

- Sull'Abus si scrive l'indirizzo della cella da leggere
- Sul Cbus si attivano i segnali di lettura
- · Sul Dbus la memoria scrive il contenuto della cella.

#### Scrittura:

- Sull'Abus si mette l'indirizzo della cella da leggere
- Sul Cbus si attivano i segnali di scrittura
- Sul Dbus si scrive il valore da memorizzare nella cella.

#### Segnali di controllo

- · Permettono alla memoria di sapere
  - il tipo di operazione richiesta (lettura o scrittura)
  - quando gli indirizzi sono disponibili sull'Abus
  - quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la scrittura).
- Deve inoltre esistere un meccanismo con il quale è possibile sapere
  - quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la lettura)
  - quando è possibile procedere con un nuovo ciclo di accesso alla memoria.

## Segnali di cor

Soluzione sincrona: la memoria e chi la utilizza condividono un segnale di clock (o informazioni di tempo) e quindi sanno quando possono procedere con ciascuna operazione

rittura)

- Permettono alla memoria di sapere
  - il tipo di operazione richiesta (letty

all'Abus

- quando gli indirizzi sono disponj
- quando i dati sono disponibil al Dbus (solo per la scrittura).
- Deve inoltre esistere un meccanismo con il quale è possibile sapere
  - quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la lettura)
  - quando è possibile procedere con un nuovo ciclo di accesso alla memoria.

## Segnali di

Soluzione <u>asincrona</u>: la memoria e chi la utilizza non condividono nessun segnale di clock (o informazioni di tempo) e quindi necessitano di segnali di controllo che dicono quando è possibile procedere con ciascuna operazione

scrittura)

- Permettono alla memoria di s
  - il tipo di operazione richiesta ()
  - quando gli indirizzi sono disp/
  - quando i dati sono disponily scrittura).

a sull'Abus

sul Dbus (solo per la

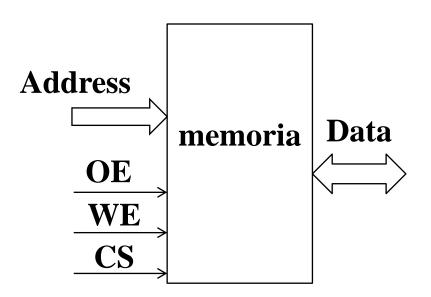
- Deve inoltre esistere un meccanismo con il quale è possibile sapere
  - quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la lettura)
  - quando è possibile procedere con un nuovo ciclo di accesso alla memoria.

### Esempio di segnali di controllo

- Chip Select (CS):
  - da attivare per poter leggere o scrivere
- Output enable (OE)
  - da attivare per poter abilitare l'uscita del chip su un bus condiviso
  - serve a poter collegare molti chip di memoria ad un singolo bus
- Write enable (WE)
  - da attivare per poter effettuare una operazione di scrittura.

### **Esempio**

- Per scrivere:
  - CS attivo
  - Indirizzo sulle linee di Address
  - Dato in input sulle linee di Data
  - WE attivo
  - Per leggere:
    - CS attivo
    - Indirizzo sulle linee di Address
    - OE attivo
    - Dato in output sulle linee di Data

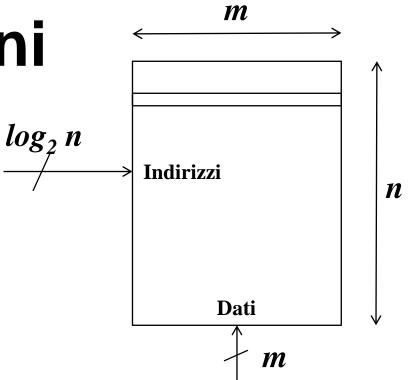


#### Segnali di stato

#### **Esempi:**

- Errore
  - La memoria ha individuato una parola con un dato errato
- MFC
  - La memoria ha completato l'operazione di lettura/scrittura.

#### **Dimensioni**



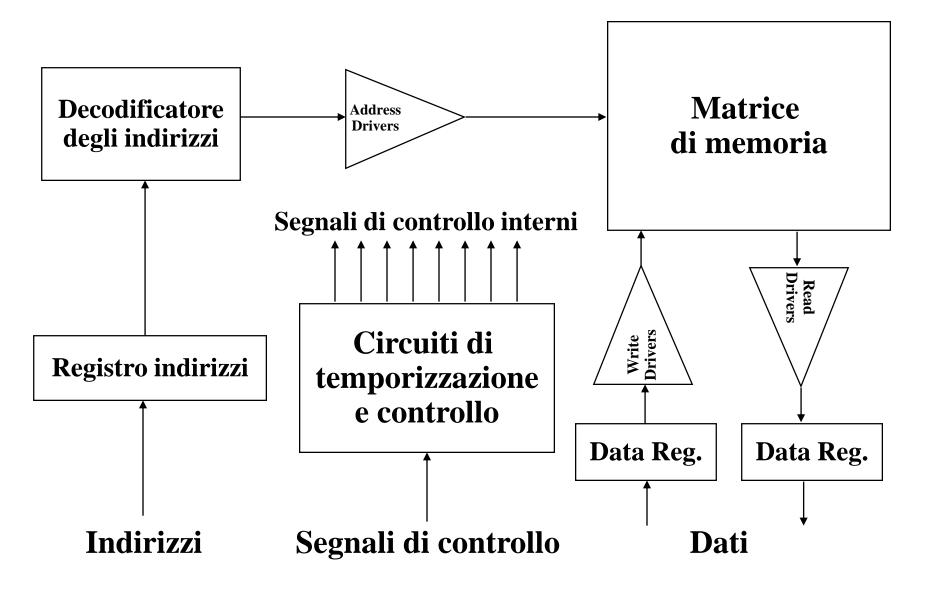
Sono caratterizzate da

- numero di parole (n)
- numero di bit per parola (m).

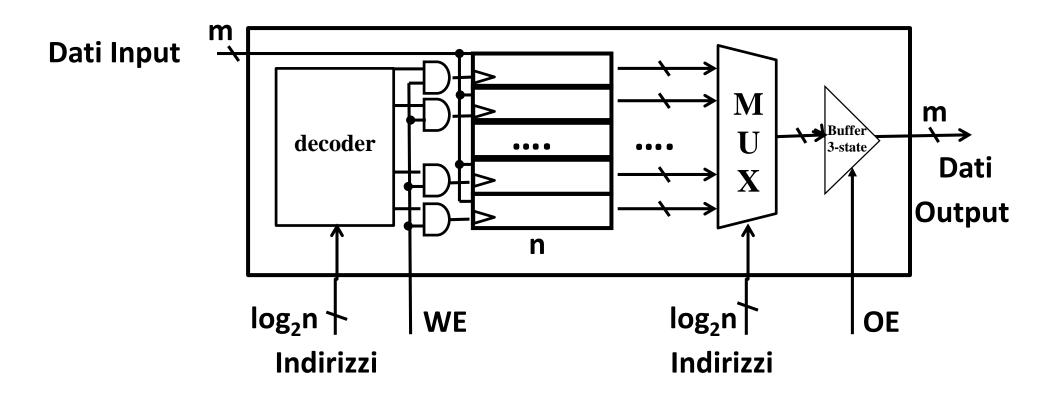
Il numero di segnali di ingresso/uscita è conseguentemente

- $log_2 n$  per i segnali di indirizzo
- m per i segnali di dato.

#### **Architettura**



## Schema generale



#### Organizzazione

Il costo di una RAM dipende anche dalla complessità dei dispositivi di accesso.

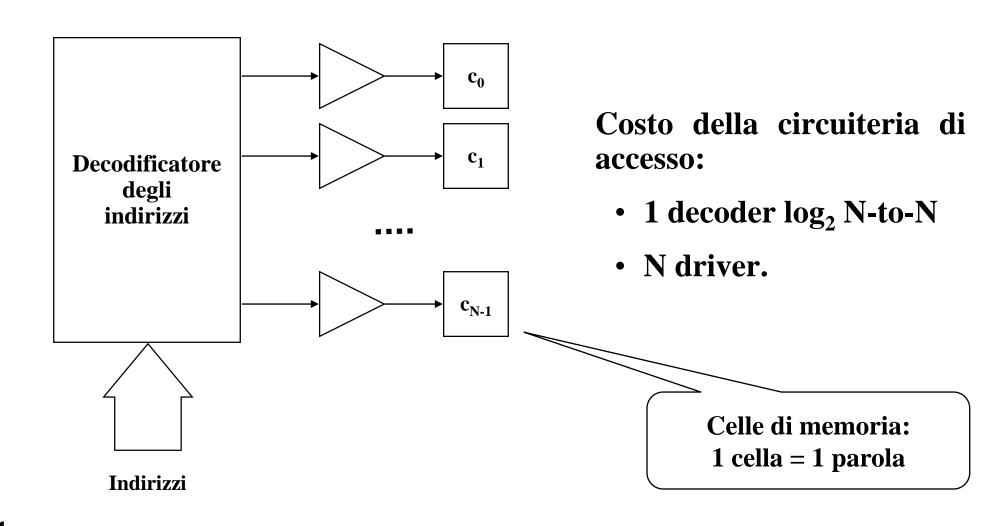
Questa può essere ridotta tramite un'opportuna organizzazione delle celle di memoria.

Si hanno due tipologie principali:

- organizzazione a vettore
- organizzazione a matrice bidimensionale.

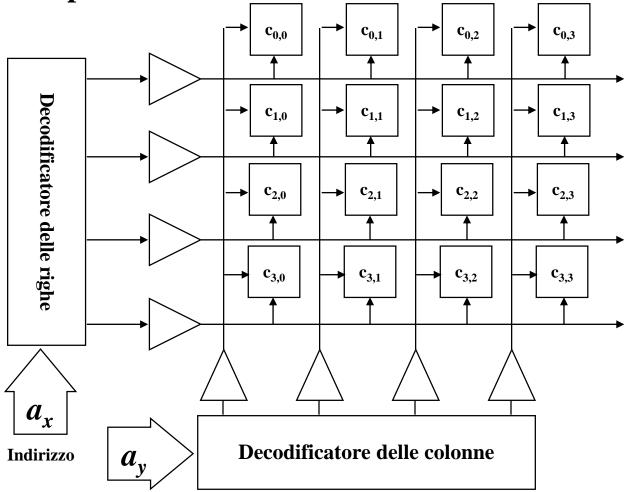
La regolarità nell'organizzazione delle celle di memoria influenza pesantemente anche il costo del layout.

#### Organizzazione a vettore



### Organizzazione a matrice

L'indirizzo a è suddiviso in 2 parti  $a_x$  e  $a_y$ , che selezionano la riga e la colonna in cui si trova la cella di memoria, rispettivamente.



Costo della circuiteria di accesso:

- 2 decoder  $(\log_2 \sqrt{N})$ -to- $\sqrt{N}$
- $2\sqrt{N}$  driver.

## Organizzazione a matrice: vantaggi

- Minor costo dell'HW
- Layout più compatto.

### Segnali RAS e CAS

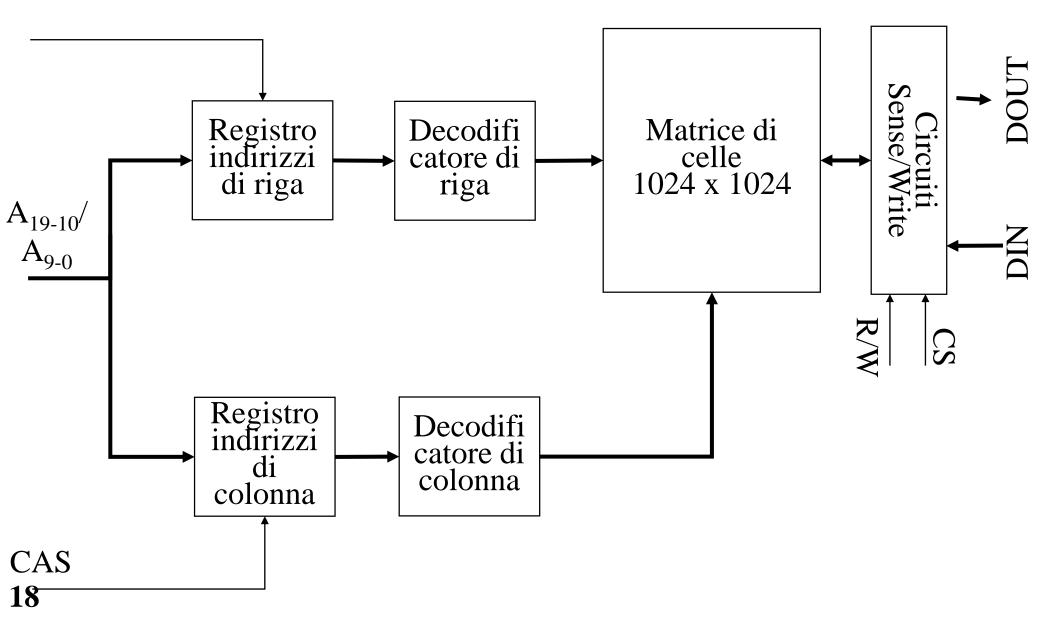
Per ridurre il numero di segnali di ingresso, le RAM organizzate a matrice talvolta prevedono un diverso protocollo di accesso e un numero ridotto di segnali di indirizzo (indicativamente la metà).

In tal caso l'indirizzo è fornito in due fasi distinte e successive, utilizzando gli stessi segnali di indirizzo:

- in una prima fase vengono forniti i segnali di indirizzo che vanno al decodificatore di riga, accompagnati dal segnale RAS (*Row Address Strobe*)
- in un'altra fase vengono forniti i segnali di indirizzo che vanno al decodificatore di colonna, accompagnati dal segnale CAS (*Column Address Strobe*).

#### **Esempio**

**RAS** 



### Page Mode

Qualora sia necessario accedere consecutivamente a celle poste ad indirizzi successivi, e queste risiedano nella stessa riga della matrice, è possibile attivare il cosiddetto *Page Mode*:

- 1 si invia alla memoria la parte di indirizzo relativo alla riga, accompagnata da RAS
- 2 si invia alla memoria la parte di indirizzo relativo alla colonna, accompagnata da CAS
- 3 si accede al dato
- 4 si ripete dal punto 2.

In questa maniera è possibile ridurre i tempi di accesso alla memoria.

#### Memorie a semiconduttore

- Le memorie sono attualmente i dispositivi a più alta densità realizzati su IC
- Al crescere dell'integrazione è possibile
  - aumentare la capacità (a parità di dimensione)
  - aumentare la velocità
  - ridurre il consumo.

#### Classificazione

- ROM (Read Only Memory)
- PROM (Programmable Read Only Memory)
- EPROM (Electrically Programmable Read Only Memory)
- EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)
- Flash
- RAM.

#### **ROM**

#### **Applicazioni:**

- librerie di procedure frequentemente usate
- programmi di sistema
- tavole di funzioni.

La definizione del contenuto avviene <u>prima</u> della realizzazione del silicio, ed il contenuto non è in alcun modo modificabile in seguito.

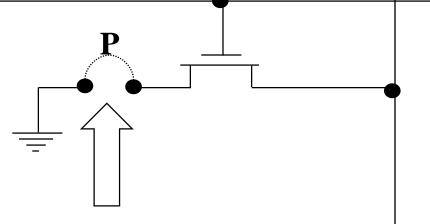
Il costo è dominato dal costo fisso per allestire la linea di produzione del dispositivo, ed è quasi indipendente dal numero di chip prodotti.

L'impatto di qualsiasi errore di progetto è drammatico.

La linea di parola è pilotata dal decodificatore degli indirizzi

#### Cella ROM

Linea di parola



Connesso per memorizzare uno 0 Non connesso per memorizzare un 1

Linea di dato

#### **PROM**

La scrittura è eseguita a valle del processo di produzione tramite speciali attrezzature denominate *programmatori*.

Fisicamente, sono realizzate ponendo nel punto P del disegno precedente un diodo, che può essere *bruciato* durante la programmazione, creando un circuito aperto.

La scrittura può avvenire una volta sola.

La PROM è non volatile.

Sono preferibili alle ROM per bassi volumi.

#### **EPROM**

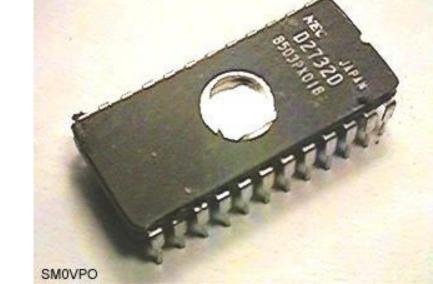
Possono essere riprogrammate, previa precedente cancellazione tramite esposizione prolungata (~20 min) a luce ultravioletta.

La scrittura può avvenire un numero indefinito di volte.

La scrittura può avvenire anche dopo il montaggio sulla

scheda.

Sono più costose delle PROM.



#### **EEPROM**

Le EEPROM (o  $E^2PROM$ ) possono essere riprogrammate byte per byte anche dopo il montaggio sulla scheda, ma l'operazione richiede più tempo di quella di lettura (centinaia di  $\mu s$ ).

La scrittura può essere eseguita tramite i normali canali (bus) e segnali.

Sono più costose e meno dense delle EPROM.

#### **Flash**

Il costo è intermedio tra quello di EPROM ed EEPROM.

Usano un solo transistor per bit, e sono quindi relativamente dense.

In lettura si comportano come le DRAM, mentre le operazioni di scrittura

- sono più lente (di almeno un ordine di grandezza)
- vanno eseguite a blocchi
- · richiedono una precedente operazione di cancellazione.

Le Flash sono inoltre in grado di eseguire un numero limitato di cicli di scrittura.

### Flash (II)

#### Esistono due tipi di memorie Flash:

- Flash di tipo NOR: hanno lo stesso comportamento di una RAM, ma sono più lente e resistono per un numero limitato di cancellazioni/scritture
- Flash di tipo NAND: possono essere lette e scritte solo a blocchi (da centinaia a migliaia di bit). Sono più dense, più veloci e più resistenti.

#### Quadro di sintesi

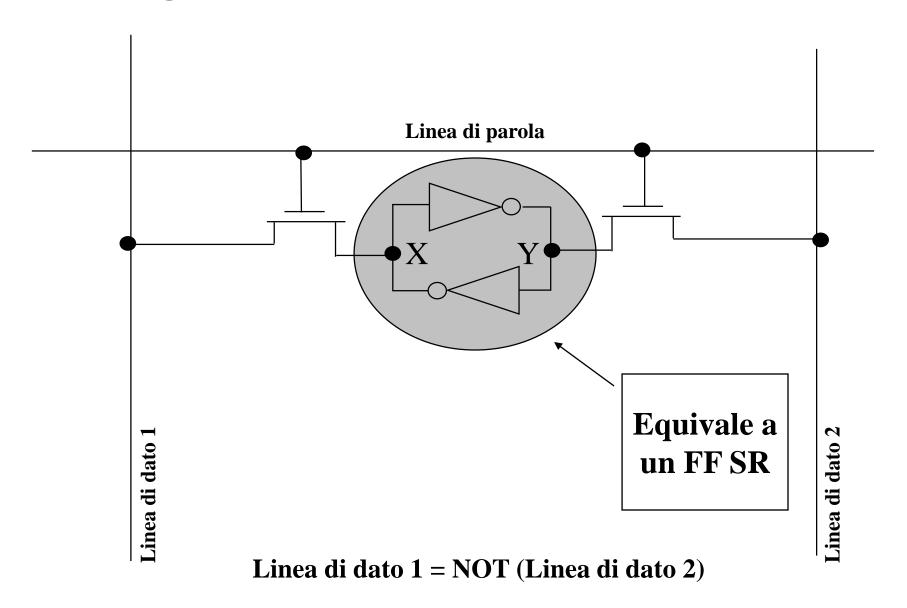
<u>Tipo</u>	Categoria	Cancellazione	Scrittura	<u>Volatilità</u>
RAM	read/write	elettricamente	elettricamente	volatile
ROM	read-only	impossibile	in fase di produz.	non-volatile
PROM	read-only	impossibile	elettricamente	non-volatile
<b>EPROM</b>	read-mostly	luce UV	elettricamente	non-volatile
<b>EEPROM</b>	read-mostly	elettricamente	elettricamente	non-volatile
Flash	read-mostly	elettricamente	elettricamente	non-volatile

#### **RAM**

#### Sono di 2 tipi:

- memorie statiche (o SRAM):
  - la singola cella corrisponde a un flip flop
- memorie dinamiche (o DRAM):
  - la singola cella corrisponde a un condensatore e a un transistor
  - l'informazione è memorizzata sotto forma di carica del condensatore
  - richiedono un rinfresco periodico dell'informazione
  - la lettura è di tipo distruttivo (Destructive Read-Out).

#### Cella di RAM statica



#### **Funzionamento**

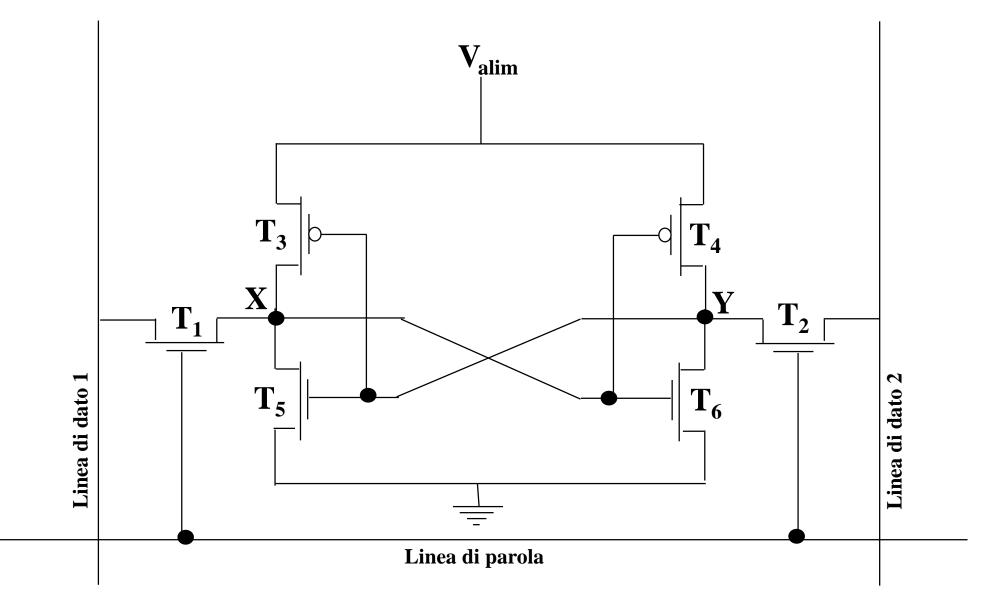
Per leggere o scrivere una parola si deve attivare la relativa linea di parola.

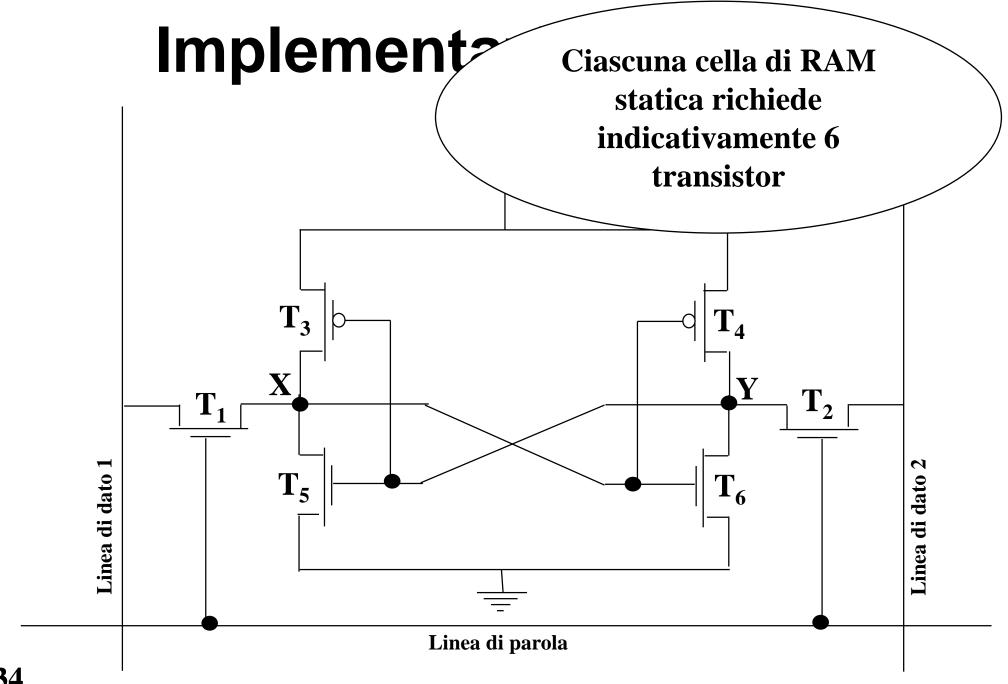
Quando la linea di parola non è attivata, il relativo flip flop mantiene il proprio valore.

Quando la linea di parola è attivata, è possibile

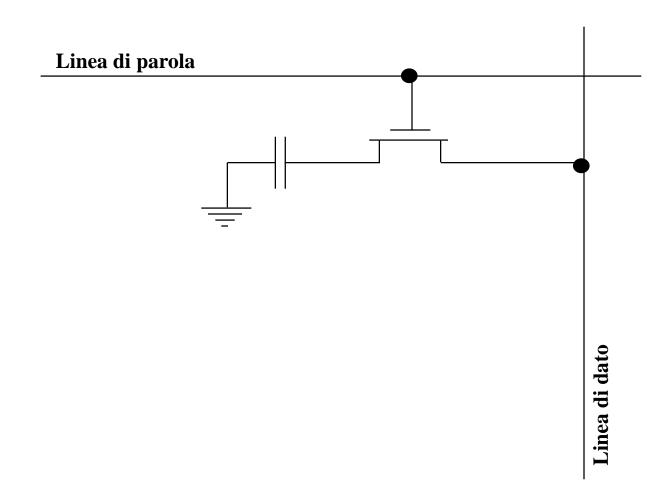
- leggere i valori (opposti) forzati dal flip flop sulle due linee di dato (*lettura*)
- scrivere un nuovo valore, forzando due valori opposti sulle linee di dato (scrittura).

## Implementazione CMOS





#### Cella di RAM dinamica



#### **Funzionamento**

Nelle operazioni di lettura, attivando la linea di parola il condensatore viene collegato alla linea di dato, che assume quindi un valore 0 o 1 a seconda del valore memorizzato.

Nelle operazioni di scrittura, l'attivazione della linea di parola provoca il collegamento della linea di dato con il condensatore, che viene quindi caricato o scaricato, a seconda del valore di questa.

Un apposito sensore collegato alla linea di dato è in grado di rilevare l'eventuale cambiamento di tensione causato dalla carica/scarica del condensatore, e di produrre il corrispondente bit.

#### **Destructive Readout**

- L'operazione di lettura comporta l'annullamento della carica elettrica immagazzinata nel condensatore con la conseguenza della perdita dell'informazione binaria (ossia da 1 si passa a 0)
- Ad ogni lettura la memoria, in modo autonomo, deve forzare un ciclo di scrittura per ripristinare il valore letto.

#### Rinfresco

Consiste nell'operazione di amplificazione (verso 1) della eventuale carica contenuta nel condensatore, che tende a 0 per l'esistenza di inevitabili correnti di dispersione.

Si basa su operazioni di lettura fittizie, nelle quali il valore letto non viene trasmesso all'esterno.

È indispensabile per poter mantenere indefinitamente il contenuto di ciascuna cella di DRAM.

Le operazioni di rinfresco occupano una RAM per tempi molto brevi (dell'ordine di qualche %).

### Circuiteria per il rinfresco

In passato doveva venir gestito da circuiteria apposita esterna ai chip di DRAM. Attualmente è quasi sempre realizzato con il supporto di apposita circuiteria interna. È quindi quasi trasparente all'utente.

È possibile che le operazioni di rinfresco (prioritarie) e quelle di accesso normale siano attivate contemporaneamente: in tal caso è necessario che l'operazione normale sia temporaneamente sospesa.

#### Stima di costo

Periodo di rinfresco = 64 ms

Tempo minimo di accesso a parola = 50 ns

Numero di cicli di rinfresco = 8k

Durata del ciclo di rinfresco =  $8k \times 50 \text{ ns} = 0.41 \text{ ms}$ 

Costo complessivo = 0.41 / 64 ms = 0.64%

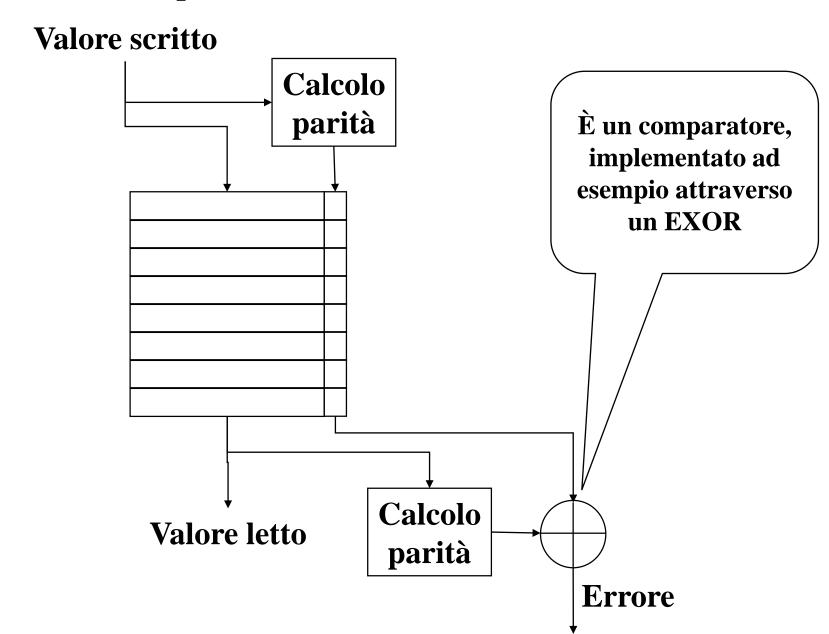
### **Affidabilità**

- Se una cella di memoria dinamica è colpita da una particella carica è possibile che la carica immagazzinata cambi, facendo cambiare il valore memorizzato (guasto transitorio)
- Al crescere della densità di integrazione, la dimensione della carica immagazzinata in ciascuna cella tende a diminuire in maniera significativa, rendendo quindi la memoria sempre più sensibile (e meno affidabile)
- Molte memorie dinamiche sono per questo protette, ad esempio tramite l'uso di codici di protezione.

### Codice di protezione

- Per aumentare l'affidabilità delle memorie, a ciascuna parola può essere associato un codice di protezione
- Il caso più semplice di codice di protezione è il codice di parità (1 bit)
- Funzionamento:
  - quando si scrive un valore nella parola, si calcola il relativo bit di parità, e lo si memorizza insieme al nuovo valore in un'apposita colonna
  - quando si legge la parola, si calcola il codice di parità associato al valore letto, e lo si confronta con quello memorizzato
  - in caso di diversità, si invia una segnalazione di errore.

## Codice di parità: architettura



### Codici di Hamming

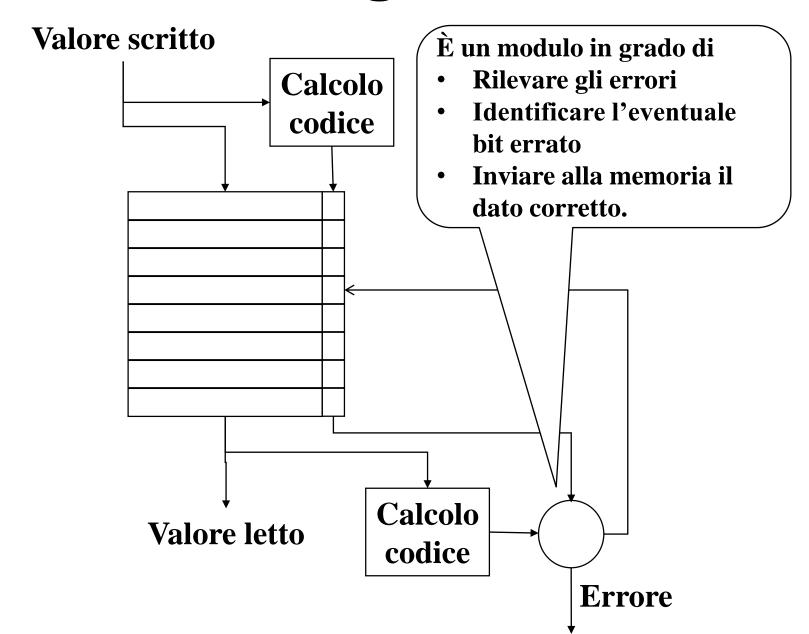
Attraverso i codici di Hamming è possibile non solo rilevare, ma anche correggere eventuali errori verificatisi in una memoria.

Detto n il parallelismo della memoria, tali codici

- Richiedono  $1 + log_2 n$  bit di codice
- permettono di rilevare e correggere tutti gli errori singoli
- permettono di rilevare (ma non correggere) tutti gli errori doppi.

Per questo tali codici sono detti SECDED (Single Error Correction Double Error Detection).

## Codice di Hamming: architettura



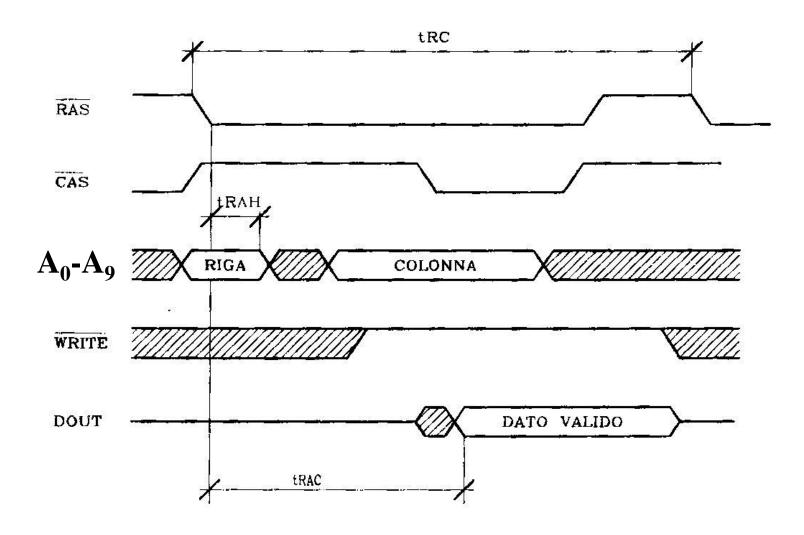
### **Esempio**

Si consideri la DRAM AS4C1M16E5 prodotta da Alliance Semiconductor.

#### **Caratteristiche:**

- $1 \text{ M} \times 16 \text{ bit}$
- Organizzazione a matrice quadrata
- Pin:
  - $A_0 A_9$ : indirizzo
  - RAS, CAS (attivi bassi)
  - **DQ1 DQ16:** dati
  - WE: abilitazione a scrittura (attivo basso)
  - OE: abilitazione uscite (attivo basso).

### Temporizzazioni



#### Lettura

- Si mette su  $A_0 A_9$  l'indirizzo di riga
- Si attiva RAS
- Si aspetta il tempo t<sub>RAH</sub>
- Si mette su  $A_0 A_9$  l'indirizzo di colonna
- Si attiva CAS
- Trascorso il tempo  $t_{RAC}$  i dati sono disponibili su DOUT.

#### **Note**

- Non si può iniziare un nuovo ciclo di lettura o scrittura se non dopo che è passato un tempo  $t_{RC}$  (pari a 100 ns).
- Ogni 16 ms è necessario eseguire un rinfresco completo, ossia eseguire 1024 operazioni con indirizzo di riga crescente.

#### RAM statiche e RAM dinamiche

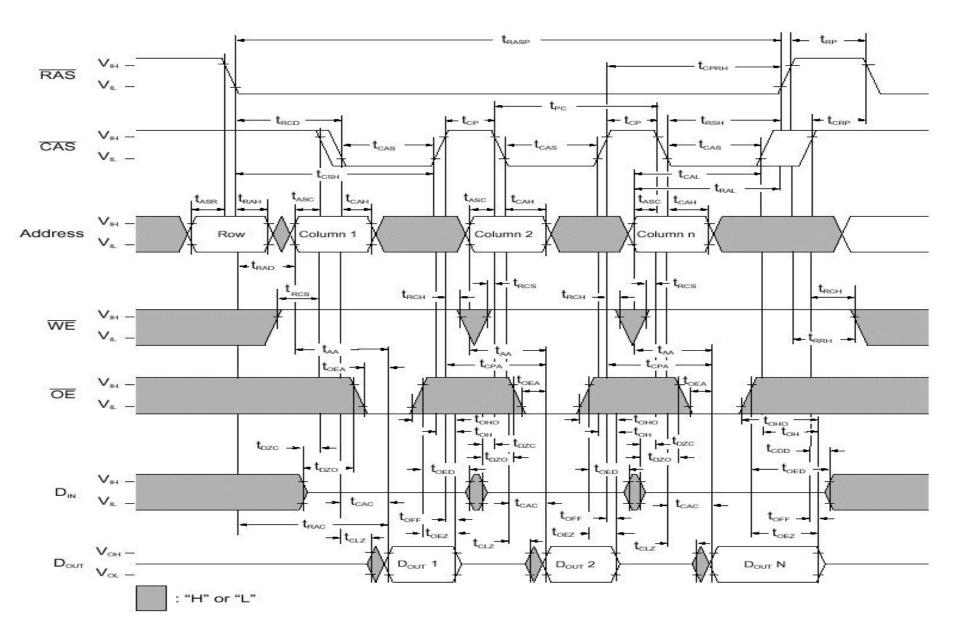
#### Le RAM statiche sono (rispetto a quelle dinamiche):

- più veloci (tempi di accesso dell'ordine di 10 ns, contro 100 ns)
- più costose (in termini di area di silicio richiesta, quindi meno dense)
- più semplici da utilizzare
- più affidabili.

### Page Mode DRAM

• Durante la lettura il valore di RAS rimane attivo ed è possibile leggere un blocco di parole appartenenti alla stessa riga (detta *pagina*) attraverso cicli successivi in cui vengono caricati esclusivamente gli indirizzi di colonna (attivando il segnale CAS).

# Ciclo di lettura in Fast Page Mode



#### Memorie interlacciate

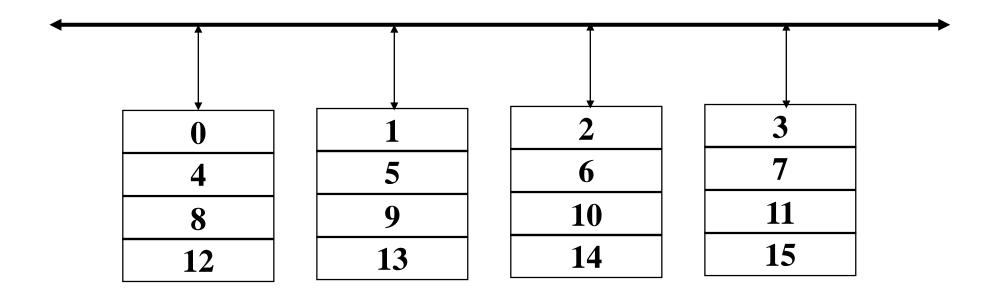
Sono composte da più moduli di memoria.

Le parole sono disposte in maniera alternata tra i vari moduli.

Quando si fa accesso ad una serie consecutiva di parole, queste si trovano in moduli diversi, ed il loro accesso può essere fatto in parallelo, utilizzando un bus più ampio.

Permettono quindi di ridurre il tempo di accesso complessivo nel caso di accessi a blocchi, come quelli che si verificano nel caso sia presente una cache.

### Memorie interlacciate: esempio



### Banchi di memoria in 8086

